Search Note	S
# 100171 00170 (8111 10011 108(8 NE11 10819	######################################

Applicat	ion/Control No.	Applicant(s)/Patent und Reexamination	er
09/772,	762	MAKINO ET AL.	
Examine	or	Art Unit	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
XIAO M	. WU	2674	

		 	
<u> </u>	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
UPDATE	SEARCH	6/15/2005	X.W.

INT	INTERFERENCE SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner

	DATE	EXMR
	•	
	•	
	•	
	•	
		1
• •		
	•	
	•	